

# MICROSCOPIE À FORCE ATOMIQUE (AFM)

---

FABRICANT : Digital Instruments Veeco

---

MODÈLE : NanoMan VS

---

## Échantillons

- Samples size : 150 mm maximum

## Analyses

- Mode : contact, non-contact, force latérale, image de phase, force magnétique, force électronique, potentiel de surface et résonance de torsion.
- Plage de balayage : 90  $\mu\text{m}$  (X-Y), 9  $\mu\text{m}$  (Z)
- Nombre de points de mesure par image : 5120 x 5120
- Résolution : 16 bits
- Platine motorisée : plage d'opération de 120 x 100 mm

## Applications

- Analyse des petites surfaces de phase
- Validation de surfaces finies de photorésines à l'échelle nanométrique
- Analyse de surface de matériaux durs

## Caractéristiques

- Bruit en Z : moins de 0.1 nm RMS
- Résolution unidirectionnelle : 2  $\mu\text{m}$
- Vitesse et dimensions de balayage ajustables
- Taille d'échantillons : 150 mm maximum
- Épaisseur : 12 mm maximum
- Limitations: certains matériaux semi-cristallins peuvent être analysés
- Incompatibilité: tous les matériaux mous